



تشخیص پرتو دیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه گیری امپدانس الکتریکی

منیره شریف زاده^{*}، مصطفی سهرابپور

مرکز تابش گاما، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۸۴۸۶ - ۱۱۲۶۵، تهران - ایران

چکیده: در این کار پژوهشی، هویت سیب زمینی پرتو دیده (نوع آلفا)، به وسیله امپدانس الکتریکی آن تعیین و بررسی شده است. اعمال جریان متناوبی حدود ۳ میلی آمپر هر راه با تغییردادن بسامد آن توسط الکترودهای فلزی که درون بشی از سبب زمینی فروبرده می شود، سبب تغییر امپدانس آن شده و در بسامدهای خاصی تشخیص امکان پذیر می گردد. پارامترهای موردنظر عبارتند از: نسبت امپدانسها از صفر تا ۱۸۰ ثانیه (Z_0/Z_{180}) پس از قراردادن الکترود در نمونه، همچنین نسبت آنها در بسامدهای بالا (۵۰ kHz) به بسامدهای پایین (kHz)، ۵٪، نتایج آزمایشها نشان میدهند که افزایش مقدار ڈز باعث افزایش امپدانس می شود، در صورتی که افزایش بسامد جریان موجب کاهش آن می گردد، به طوری که عملاً تشخیص نمونه های پرتو دیده در بسامدهای بالاتر از ۵ kHz امکان پذیر نخواهد بود. همچنین نسبت Z_{50k}/Z_{5k} به سبب بستگی داشتن به ڈز جذب شده و تغییرات اندک آن در مدت نگهداری نمونه ها بهترین پارامتر برای تعیین هویت نمونه های پرتو دیده، حتی حدود ۶ ماه پس از پرتو دیده است و می توان با آن مقدار ڈز را نیز برآورد کرد. از نتایج تجربی بدست آمده در بسامدهای ڈز شده نیز روابط ریاضی مناسبی که نمایانگر ارتباط امپدانس با ڈز جذب شده و دمای اندازه گیری باشد در قالب سه فرمول استنتاج شد. با این فرمولها می توان مقدار ڈز را در محدوده دمای اندازه گیری شده (۲۰ - ۳۵°C) با خطای حد اکثر ۸ درصد برآورد کرد.

واژه های کلیدی: بسامد، امپدانس، پارامتر تشخیص پرتو دیدگی، سیب زمینی پرتو دیده

Identification of Irradiated Potatoes by Impedance Measurements

M. Sharifzadeh*, M. Sohrabpour

Gamma Irradiation Center, AEOI, P.O.Box: 11365 – 8486, Tehran - Iran

Abstract: Identification of irradiated potatoes (Alpha variety) by the electrical impedance measurements has been carried out. Experiments were performed by passing ~3mA alternating current through the potato tubers that were punctured with the galvanized metallic electrodes. The parameters Z_0/Z_{180} (impedance ratio at 50Hz, zero to 180 seconds post puncturing), Z_{50k}/Z_{5k} , $Z_{50k}/Z_{0.5k}$, $Z_{50k}/Z_{0.05k}$ (impedance ratio at 50kHz to 5kHz, 0.5kHz and 0.05kHz, respectively) were determined at various temperatures and the best temperature for the measurement was obtained. The selection of the identification parameter was based on its constancy over the post irradiation storage time (six months), as well as, its dependency on the magnitude of the absorbed dose. Based on the above criteria, the impedance ratio of Z_{50k}/Z_{5k} was determined to be the best identification parameter. The obtained empirical formulas allow to estimate the applied dose and also to differentiation between the irradiated and unirradiated potatoes at the temperature of the (20-35°C).

Keywords: frequency, impedance, identification parameter, irradiated potato



یا مقدار عناصر موجود در سیب زمینی، مانند کربوهیدراتها، اسیدهای آمینه و ویتامینها می باشد که مقادیر آنها در اثر این عوامل تغییر می‌کند [۱ و ۲]. استفاده از امپدانس و هدایت الکتریکی یکی از روش‌های عملی و قابل اعتماد برای تشخیص پرتو دیدگی مواد غذایی غده‌ای، از جمله سیب زمینی است. بنابراین، برای تعیین هویت سیب زمینی پرتو دیده (نوع آلفا)، استفاده از اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش‌هایی به منظور بررسی اثرهای بسامد جریان متناوب، مقدار ذُر جذب شده، زمان اندازه گیری، مدت نگهداری، حرارت و غیره بر امپدانس و انتخاب بهترین شرایط برای تشخیص پرتو دیدگی انجام شده است.

۲- روش کار

در این کار تحقیقی، نمونه‌های سیب زمینی (نوع آلفا) بکار رفته و پرتو دیده آنها به وسیله گاماسل ۲۲۰ با نرخ ذُر (kGy/h) $(\pm 0.44 / 8.86)$ صورت گرفته و ذُرهاي 1000 100 500 200 100 50 10 گری اعمال شده است. نمونه‌های پرتو دیده شده، پس از پرتو ندیده در انکوباتور $15^{\circ}C$ نگهداری شدند.

اندازه گیری امپدانس در دمای $25^{\circ}C$ به وسیله الکترود های سوزنی شکل از جنس فلز زنگ نزن، به قطر 0.9 میلی‌متر و با طول 10 میلی‌متر و به فاصله 10 میلی‌متر از یکدیگر انجام گرفته است (شکل ۱). این الکترود ها را به نوسان نما (اسیلوسکوپ) متصل کرده و پس از فروکردن آنها در سیب زمینی و برقراری جریان متناوب حدود 3 میلی آمپر بین آنها، با اندازه گیری ولتاژ های موردنظر، امپدانس محاسبه می‌شد. ولتاژ ها بلافاصله پس

۱- مقدمه

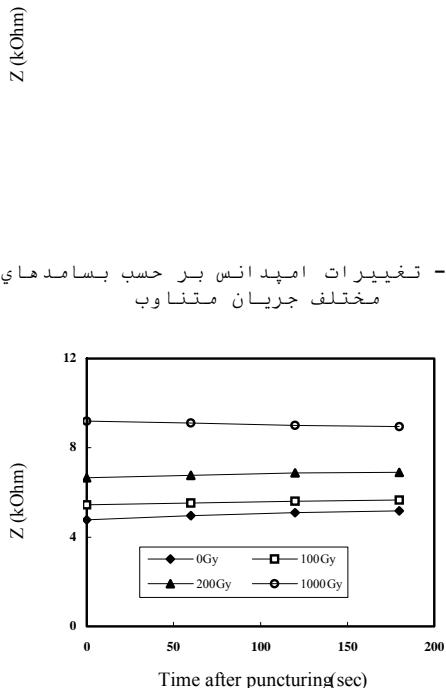
فرایند پرتو دیده مواد غذایی د بعضی از کشورهای جهان در شرای استاندارد مجاز اعلام شده، حالیکه در کشورهای دیگر به علت مخالفت مصرف کنندگان و یا نهادهای کنترل کننده، پذیرفته نشده است. پرتو دیده عموماً باعث تغییرات ظاهری در مواد غذایی نمی شود و تشخیص یک ماده غذایی پرتو دیده از پرتو ندیده به سختی امکان‌پذیر است. از این رو در بیشتر کشورهای جهان توجه زیادی به تحقیق درباره روش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیست‌شناسی برای تشخیص پرتو دیدگی مواد غذایی وجود داشته و تعیین هویت مواد غذایی پرتو دیده توسعه دستگاههای کنترل کننده با استفاده از روش‌های متدال از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از کاربردهای پرتو دیده مواد غذایی جلوگیری از جوانه زدن پیازها و غدد (سیب زمینی) با استفاده از ذرهای کم پرتوهای یونیزه کننده است. تحقیقات (Delincee ۱۹۹۱) درباره ویژگیهای بافت سیب زمینی پرتو دیده نشان داده است که مقدار ذُر جذب شده کمتر از $150 Gy$ هم ممکن است تغییراتی در امپدانس الکتریکی آن ایجاد کند که مبنای تشخیص پرتو دیدگی سیب زمینی می‌شود. امپدانس یک گیاه بستگی به شرایط فیزیولوژیکی آن دارد و می‌توان آنرا برای بررسی آلودگیهای ویروسی، وضعیت زمستان گذرانی جوانه‌ها و همچنین تشخیص بافت‌های پرتو دیده از پرتو ندیده بکار برد [۱].

روشی که بتوان با آن سیب زمینی های پرتو دیده را تشخیص داد باید به ذُر پرتو دیده بستگی داشته و مستقل از عوامل دیگر، از جمله نگهداری، رشد، تولید و نوع سیب زمینی باشد. روش‌های بکار رفته، اغلب مربوط به فعالیت آنزیم‌ها،

۱۰۰۰ گری پرتو دیده اند کا هش می یابد (شکل ۳). این نتایج نشان می دهند که نسبت تغییر امپدانس نمونه ها (از لحظه

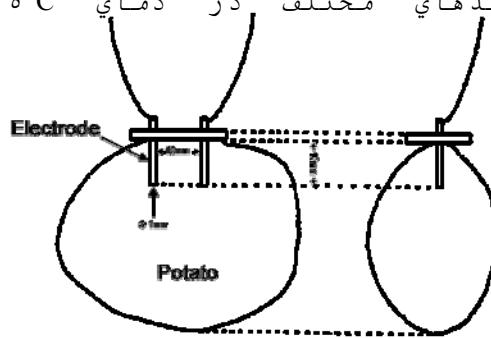
از فروکردن الکتروودها در نمونه و حد اکثر تا ۳ دقیقه پس از آن، در بسامدهای مختلف اندازه گیری شدند [۲] و [۳].



شکل ۲- تغییرات امپدانس بر حسب بسامدهای مختلف جریان متناوب

شنبه، سوی رسانی سیبریت سپرس ب رسن در بسامد ۵۰Hz و در پرتو دهی های مختلف پس از سوراخ کردن سیب زمینی با الکتروودها سوراخ کردن نمونه تا ۱۸۰ ثانیه پس از آن) یعنی Z/Z_{180} به علت تغییر امپدانس، معمولاً برای تشخیص پرتو دیدگی مناسب می باشد [۲]. این نسبت برای نمونه های پرتو دیده در ڈزها و بسامدهای مختلف، که به مدت یک هفته در دمای ۱۵°C نگهداری شده بودند در دمای محیط (۲۵°C) اندازه گیری شد. مقدار بدست آمده، متوسط ۶ اندازه گیری در ۶ نمونه است. پaramتر Z/Z_{180} با افزایش ڈز تا بسامد Z/Z_{180} ۱۰kHz افزایش نشان میدهد، پس از آن تغییراتش ناچیز می شود (شکل ۴). برای انتخاب بهترین بسامد در تعیین Z/Z_{180} نسبت واریانس $F=Vr/Ve$ حساب شد [۲]، و بسامد ۵۰ هرتز به سبب دارا بودن بیشترین مقدار F (جدول ۱)، برای تشخیص پرتو دیدگی بکار رفت.

۳- یافته ها و نتیجه گیری
۳-۱ امپدانس در بسامدهای مختلف امپدانس سیب زمینی هایی که پس از پرتو دهی با ڈزهای ۰، ۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ گری به مدت یک هفته در دمای ۱۵°C نگهداری شده بودند با بسامدهای مختلف در دمای ۲۵°C



شکل ۱- طرح ساده وضع الکتروودهای فلزی مورد استفاده در اندازه گیری امپدانس سیب زمینی اندازه گیری شد. شکل ۲ نتایج این اندازه گیری را نشان میدهد. هر نقطه در این شکل معروف میانگین ۱۰ اندازه گیری در ۵ نمونه است که پس از فروبردن الکتروود در سیب زمینی بیدرنگ اندازه گیری شده است [۱] و [۵]. این شکل نشان میدهد که در بسامدهای پایین مقدار امپدانس بسته به مقدار ڈز متفاوت است ولی در بسامدهای بالا این تفاوت مشاهده نمی شود. به همین جهت، نسبت مقدار امپدانس در بسامد بالا به مقدار آن در بسامد پایین (مانند $Z_{0.5}/Z_{180}$ و $Z_{0.5}/Z_{25}$) برای تعیین اثر پرتو دیدگی مناسب است [۱] و [۲].

۳-۲ تغییر امپدانس نمونه های سیب زمینی پس از سوراخ کردن آنها با الکتروودها
امپدانس نمونه های سیب زمینی پرتو ندیده پس از سوراخ کردن شان، حد اکثر تا ۱۸۰ ثانیه افزایش می یابد، اما امپدانس نمونه های ۲۰۰ گری پرتو دیده تقریباً ثابت باقی می ماند و امپدانس نمونه هایی که



همه پارامترها در محدوده دمای 25°C دارای فاکتور F بیشتری نسبت به دماهای دیگر بوده و بیشترین مقدار F مربوط به پارامتر $Z_{0,k}/Z_{0,hk}$ میباشد. با استفاده از نتایج بدست آمده، دمای 25°C بهترین دما برای تشخیص پرتو دیدگی سیب زمینی شناخته میشود.

با توجه به شکل های ۵ تا ۷ و از نتایج تجربی بدست آمده در بسامد های مورد استفاده، روابط ریاضی نمایانگر ارتباط مناسب امپدانس با دُز جذب شده و دمای اندازه گیری در قالب سه فرمول استنتاج شد. با این فرمولها می توان مقدار دُز پرتو دیدگی را در محدوده دمای اندازه گیری (20°C - 25°C) با حد اکثر خطای $\pm 8\%$ درصد برآورد کرد:

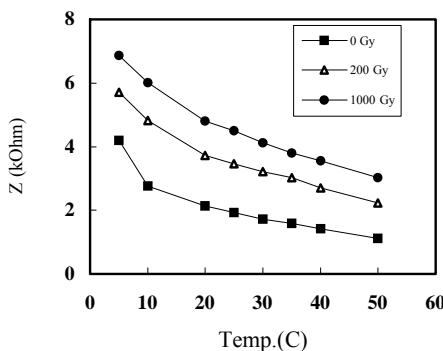
$$1) Z_{50k} = [0.29 + (0.00012D^{0.64})][6.2 - \ln(t)]$$

$$2) Z_{5k} = [1.2 + (0.12D^{0.25})][4.9 - \ln(t)]$$

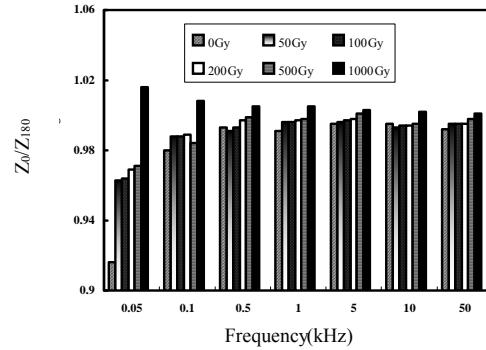
$$3) Z_{0.5k} = [1.82 + 0.63D^{0.17}][4.7 - \ln(t)]$$

Z (kOhm)

شکل ۵- تغییرات امپدانس با دمای اندازه گیری در بسامد 50 kHz



۳-۳ اندازه گیری دما
نمونه های موردنظر با دُز های $0, 200, 1000$ گری پرتو دیدگی و به مدت یک هفته در دمای 15°C نگهداری



شکل ۴- تغییرات پارامتر Z_0/Z_{180} با بسامد جریان متناوب در 25°C

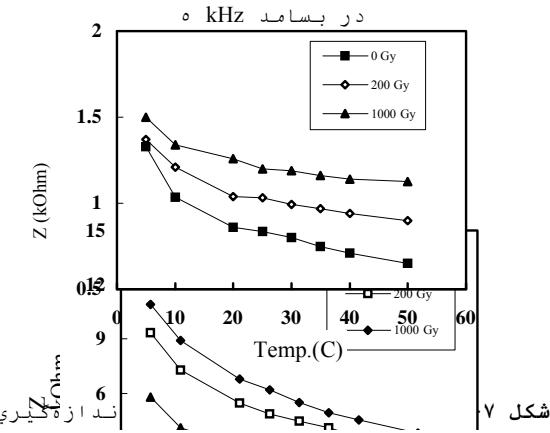
جدول ۱- نسبت واریانس ($F=Vr/Ve$) پارامتر Z_0/Z_{180} در بسامد های مختلف تشخیص پرتو دیدگی. در بسامد های جریان متناوب

بسامد (Hz)	50k	10k	5k	1k	500	100	50
F	1.22	1.93	2.45	2.44	2.46	5.65	11.46
n	60	60	60	60	60	60	60

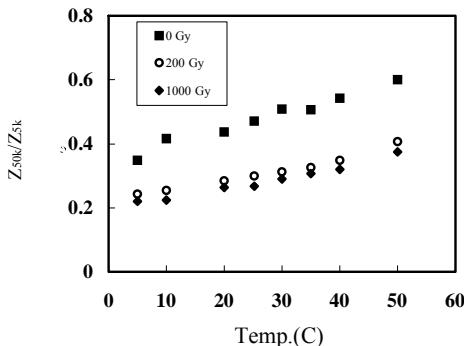
آنها با استفاده از دستگاه کنترل دما، در دماهای مختلف (از 23°C تا 50°C) و در بسامد های مختلف اندازه گیری و پارامتر های $Z_{0,k}/Z_{0,hk}$ ، $Z_{0,k}/Z_{0,k}$ و $Z_{0,k}/Z_{180}$ در هر دما حساب شدند [۱]. مقادیر نشان داده شده در شکل های ۵ تا ۹ متوسط 10°C اندازه گیری در ۵ نمونه است. در دماهای 20°C تا 35°C ، امکان تشخیص پرتو دیدگی و برآورد مقدار دُز جذب شده بیشتر است، ولی در دماهای بالاتر از این حد، امکان تعیین هویت کم میشود [۲]. برای تعیین بهترین شرایط تشخیص نمونه های پرتو دیده نسبت واریانس F برای امپدانسها و پارامتر های مختلف حساب شد (جدول ۲). تقریباً



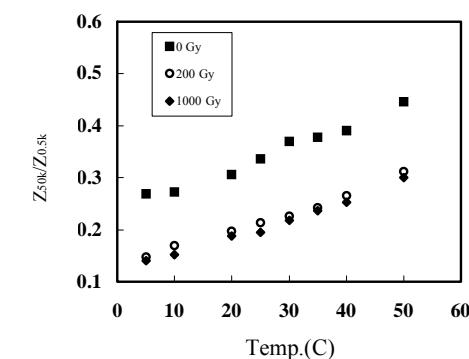
شکل ۶- تغییرات امپدانس با دمای اندازه گیری



شکل ۸- تغییرات پارامتر تشخیص پرتوودیدگی $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ با دمای اندازه گیری



شکل ۹- تغییرات پارامتر تشخیص پرتوودیدگی $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ با دمای اندازه گیری



دیدگی بدست آمده در دمای مختلف

دیدگی بدست آمده در دمای مختلف					بصیرت			$Z_{50k}/Z_{0.5k}$
۵۰	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۱۷.۶	۱۸	۶.۸	
30.1	29.7	30.9	31.7	31.9	17.6	18	6.8	$Z_{50k}/Z_{0.5k}$
30.7	20	23.1	24	34.7	22.8	30.76	15.62	Z_{5k}
29.5	31.3	29.8	31.8	31.74	16.12	15.36	6.25	Z_{50k}/Z_{5k}
31.2	22.75	29.1	20.7	24.07	28.15	29.47	21.6	$Z_{0.5k}$
28.52	27	29.24	30.72	32.75	11.04	11.77	5.2	$Z_{50k}/Z_{0.5k}$
7.06	7.8	10.7	15.5	17.7	14.8	7.87	2.1	Z_{50k}
19.5	13	13.2	14.3	12.75				

اندازه گیری امپدانس، مقادیر انحراف معیاری و آنالیز واریانس F برای پارامترهای موردنظر حساب شده اند (جدول ۳). بر طبق این جدول، پارامتر $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ همچنین امپدانس $Z_{0.5k}$ دارای بیشترین مقدار F بوده و در تمام مدت نگهداری تقریباً ثابت بوده اند، ولی پارامترهای $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ و $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ به تدریج پس از پرتوودهی تغییر کرده و مقادیر آنها پراکنده‌گی بیشتری نسبت به مقادیر پارامترهای دیگر داشته اند. به همین جهت نسبت $Z_{0.5k}/Z_{0.5k}$ در دمای ۲۵°C بهترین

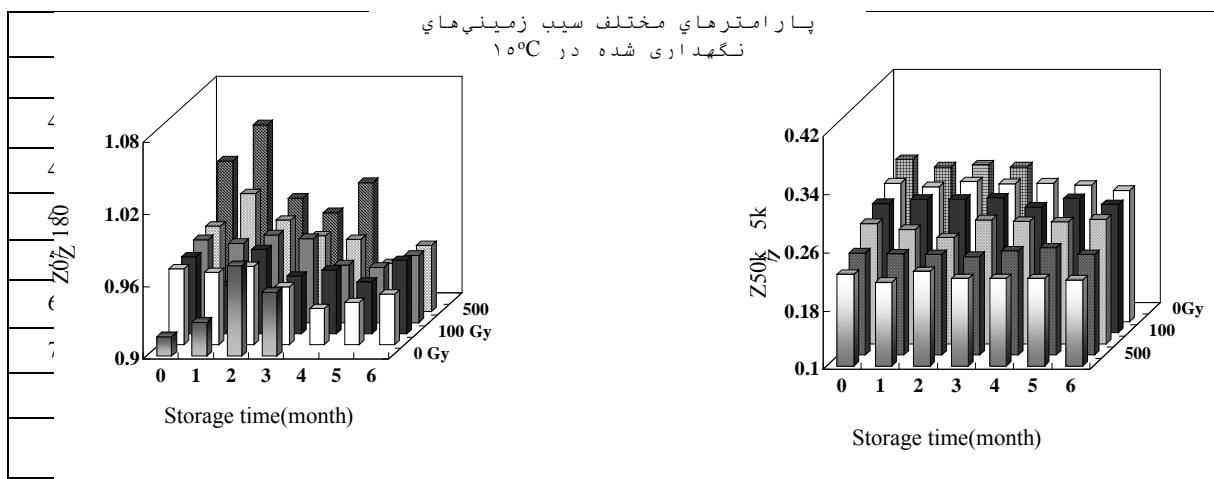
شکل ۴- تشخیص در مدت نگهداری سبب زمینی‌های پرتوودیده در دمای ۱۵°C به مدت ۶ ماه نگهداری شده اند و در این مدت امپدانس آنها در دمای ۲۵°C اندازه گیری شده است. نتایج پنج اندازه گیری در پنج نمونه در شکلهای ۱۰ تا ۱۳ نشان داده شده است [۱] و [۶]. انداده گیری امپدانس سبب زمینی‌های پرتووندیده تا ۳ ماه بیشتر تعقیب نشد، زیرا پس از گذشت یک ماه و نیم، جوانه‌ها شروع به رشد کرده و طول آنها پس از گذشت این مدت به چند سانتی‌متر رسیده بود. با توجه به نتایج بدست آمده پس از ۶ ماه

پارامتر برای تشخیص پرتو دیدگی شناخته شده است.

در مدت نگهداری به طور تقریبی بدست آورد.

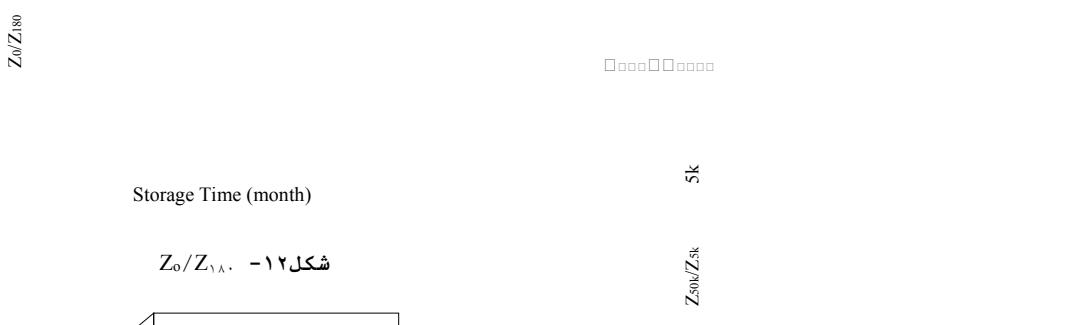
گرچه اندازه گیری امپدانس، روش عملی و قابل اعتمادی است که می توان به وسیله آن نمونه های پرتو دیده را از پرتو ندیده تشخیص داد، ولی برای کاربرد این روش، مطالعات بیشتری بر روی واریته های دیگر سبب زمینی، و شرایط دیگر از جمله دما های مختلف نگهداری و نواحی گوناگون برداشت محصول لازم است.

جدول ۳- ارتباط بین امپدانس و پارامترهای تشخیص پرتو دیدگی و ڈز پرتو دهی

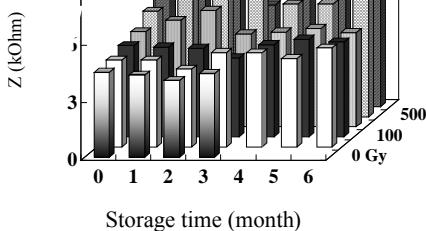


۳۰

شکل ۱۲- امپدانس در kHz



شکل ۱۰- Z_0/Z_{180} -۱۲





شکل - ۱۱ Z_{o,k}/Z_{./k}

پروژه مرا یاری نمودند تشکر و
قدرتانی مینمایم.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از خدمات
آقایان عباسعلی مرشد، علی سرلک و
حسرو محمودنژاد که در انجام این

References:

1. T. Hayashi, "Identification of irradiated potatoes by impedemetric methods," In: Health Impact Identification and Dosimetry of Irradiated Foods, Report of WHO Working Group, ericht des Institutes für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes, ISH – 125, 432-452. Nneuherberg, FRG (1988).
2. T. Hayashi, M. Iwamoto, K. Kawashima, "Identification of irradiated potatoes by impedance measurements," Agric. Biol. Chem. (Tokyo) **46**, 905-912 (1982).
3. T. Hayashi, K. Kawashima, M. Iwamoto "Impedance measurement of irradiated potatoes," Nippon Shokuhin Kogyo Gakkai-shi. Journal of Food Science and Technology, Japan 30, **1**, 51-54 (1983).
4. IAEA-TECDOC-587, "Analytical Detection Methods for Irradiated Foods," IAEA, Vienna **8** (1991).
5. T. Hayashi, S. Todoriki, K. Otobe, J. Sugiyama, "Impedance measuring technique for identifying irradiated potatoes," Biosci. Biotechnol. Biochem., **56**, 1929 (1994).
6. T. Hayashi, S. Todoriki, K. Otobe, J. Sugiyama, "Applicability of impedance measuring method to the detection of irradiation treatment of potatoes," J. Jpn. Soc. Food. Sci. Technol., **40**, 378 (1994).